

ридных ИМС 217 серии. Он может быть использован для цифрового управления синтезаторами типов Ч6-31 и Ч6-58. В этом случае цифровой дискриминатор и цепь авторегулирования не используются.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Т. М. Егорова, Н. Ф. Рыжков, Изв. Главн. астр. обсерв. в Пулкове, № 172, 194 (1964).
2. Н. Ф. Рыжков, Изв. Главн. астр. обсерв. в Пулкове, № 188, 172 (1972).
3. З. А. Алферова, Н. В. Быстрова, И. В. Госачинский, З. Г. Трунова, Изв. Главн. астр. обсерв. в Пулкове, № 188, 216 (1972).

Ленинградский филиал специальной астрофизической  
обсерватории АН СССР

Поступила в редакцию  
9 сентября 1975 г.

УДК 533.925

## ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ, ПОКРЫТОЙ РАДИАЛЬНО НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ОБОЛОЧКОЙ

В. А. Пермяков

1. В настоящей работе с помощью строгого численного решения и в приближении геометрической оптики проанализированы особенности обратного рассеяния электромагнитных волн идеально проводящей сферой с радиально неоднородной плазменной оболочкой. Показано, что при изменении параметров плазменной оболочки сечение обратного рассеяния (СОР) имеет минимум, когда концентрация электронов на поверхности сферы (при монотонно растущих законах  $\epsilon(r)$ ) равна критической. При этом эффект минимизации СОР допускает наглядную и простую физическую интерпретацию в приближении геометрической оптики.

2. Рассмотрим объяснение этого эффекта в приближении геометрической оптики. Геометрооптическое сечение обратного рассеяния сферы с радиально неоднородной плазменной оболочкой определяется в случае малых потерь формулой, являющейся очевидным обобщением аналогичной формулы для радиально неоднородной плазмы [1]:

$$\sigma_{r.0} = \frac{\pi \eta^2}{I^2}, \quad I = \frac{1}{\alpha} + \int_{r_1}^{\alpha} \frac{dr}{r^2 n(r)}, \quad \eta = \exp\left(-2 \int_{r_1}^{\alpha} \kappa(r) dr\right), \quad (1)$$

где  $n - i\kappa = \sqrt{\epsilon}$ ,  $\epsilon$  — относительная комплексная диэлектрическая проницаемость плазмы,  $\alpha$  — внешний радиус плазменной оболочки, радиус  $r_1 = \min(\rho, \rho_0)$ ,  $\rho$  — радиус металлической сферы,  $\rho_0$  — радиус отрицательного плазменного ядра, определяемый условием  $\text{Re } \epsilon(\rho_0) = 0$ . Здесь и ниже все линейные размеры нормированы умножением на волновое число свободного пространства  $k_0$ .

Для линейного закона  $\epsilon = 1 + a(r - \alpha)$ ,  $a = \text{Re } a(1 + i\bar{\nu})$  имеем при  $\bar{\nu} = 0$

$$I = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma a} \left\{ \frac{\sqrt{r - \rho_0}}{r \rho_0} + \frac{1}{2 \rho_0} \left[ \frac{2}{\sqrt{\rho_0}} \arctg \sqrt{\frac{r - \rho_0}{\rho_0}} \right] \right\} \Bigg|_{r_1}^{\alpha}, \quad (2)$$

где верхняя строчка в квадратных скобках в (2) берется при  $\rho_0 > 0$ , нижняя при  $\rho_0 < 0$ .

Физическая картина поведения сечения обратного рассеяния, как следует из (2), такова. При фиксированных радиусах сферы и плазменной оболочки с увеличением градиента диэлектрической проницаемости, пока в слое  $\epsilon > 0$ , отражение происходит от поверхности сферы, а сечение уменьшается вследствие роста рефракции лучей. Единственный минимум сечения достигается, когда концентрация электронов на поверхности

проводящей сферы равна критической. При дальнейшем увеличении градиента  $\varepsilon$  поверхность отражения приближается к внешней границе плазменной оболочки, уменьшается рефракция лучей и сечение рассеяния растет.

Рассмотрим теперь монотонные функции  $\varepsilon(r)$ , определяемые условием

$$\frac{d\varepsilon(\rho_0)}{d\rho_0} \geq \frac{d\varepsilon}{dr} \quad \text{при} \quad r \geq \rho_0. \quad (3)$$

Тогда линейная функция  $\varepsilon^*(r) = \frac{d\varepsilon(\rho_0)}{d\rho_0}(r-\rho_0)$  является мажорантой, а функция

$\varepsilon^{**}(r) = \frac{r-\rho_0}{\alpha-\rho_0}$  — минорантой монотонной функции  $\varepsilon(r)$ , откуда следует, что

$$\sigma_{г.о}(\varepsilon^*) < \sigma_{г.о}(\varepsilon) < \sigma_{г.о}(\varepsilon^{**}). \quad (4)$$

В соответствии с (4) для профилей  $\varepsilon(r)$ , определяемых условием (3), при фиксированном  $\alpha$  и переменном  $\rho_0$ , обязательно имеется минимум  $\sigma$ , причем, вследствие монотонности  $\varepsilon$ , единственный. При условии на производную  $\varepsilon$ , противоположном (3), доказательство аналогично.

3. Рассмотрим теперь некоторые результаты точных расчетов СОР, проведенных по алгоритму, предложенному в [2] (см. также [3]), и сравнение их с приближением геометрической оптики. Расчеты проводились для сферы фиксированного радиуса и фиксированной толщины плазменной оболочки на трех частотах, связанных отношением  $\omega_1 = \frac{\omega_2}{5} = \frac{\omega_3}{15}$ . Диэлектрическая проницаемость плазмы менялась по линейному

закону в диапазоне градиентов  $\varepsilon$  от 0,01 до 10. Варьировалась также частота соударений  $\nu$ . Численные результаты показаны на рис. 1—3 сплошной линией, приближение геометрической оптики — пунктиром.

Как следует из рис. 1, для сферы радиуса  $\rho = 2$  резкий минимум СОР появляется только при достаточно малых потерях. В рассматриваемом случае сравнительно малой толщины плазменного слоя приближение геометрической оптики качественно объясняет появление минимума СОР при малых потерях, но с увеличением потерь дает качественно неверный результат.

При увеличении частоты (рис. 2 и 3) эффект минимизации СОР ярко выражен и наблюдается как в отсутствие, так и при наличии потерь. Обратим внимание на «игольчатый» характер минимума  $\sigma$  для плазмы без потерь (выделен крупным масштабом в правой части рис. 3).

Приближение геометрической оптики на частотах  $\omega_2$  и  $\omega_3$  дает правильное качественное описание эффекта минимизации  $\sigma$ , а в области  $\text{Re } a < (\alpha - \rho_0)^{-1}$ , где  $\text{Re } \varepsilon(\rho) > 0$ , и хорошее количественное согласие со строгим расчетом. Несколько худшие

результаты дает приближение геометрической оптики в области  $\text{Re } a > (\alpha - \rho_0)^{-1}$  ( $\text{Re } \varepsilon(\rho) < 0$ ), что объясняется заметным вкладом дифракционных эффектов, возникающих в освещенной области радиально неоднородной плазмы с переходящим через нулевое значение законом  $\varepsilon$  [3]. Погрешность приближения геометрической оптики оказывается наибольшей в области минимума СОР.

Учет потерь в слабонеоднородной плазме, как следует из рис. 2, 3, приводит к заметному уменьшению минимального значения  $\sigma$  при одновременном увеличении ширины области минимума, в то же время положение минимума  $\sigma$  как функции параметра  $\text{Re } a$  (вещественной части градиента  $\varepsilon$ ) практически не меняется.

При небольших потерях положение минимума  $\sigma$  фиксируется приближением геометрической оптики с хорошей точностью. Учитывая это, можно использовать эффект минимизации СОР для диагностики параметров плазменной оболочки. При

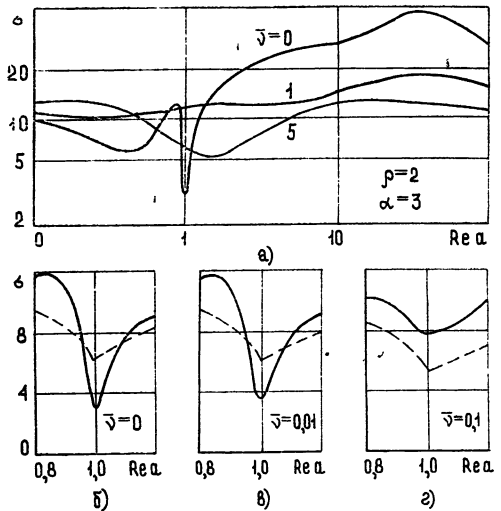


Рис. 1.

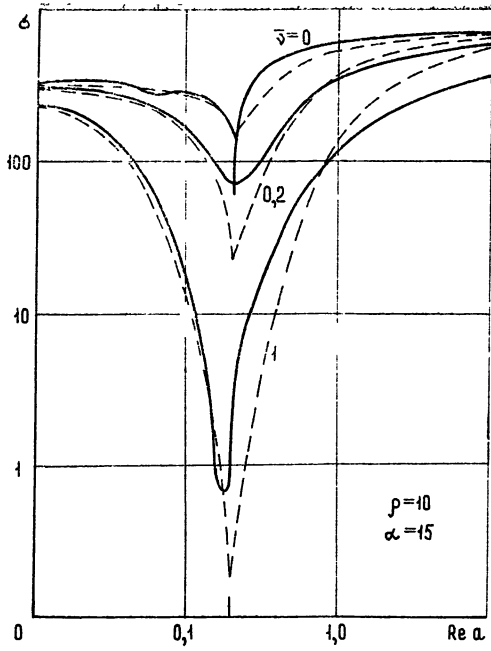


Рис. 2.

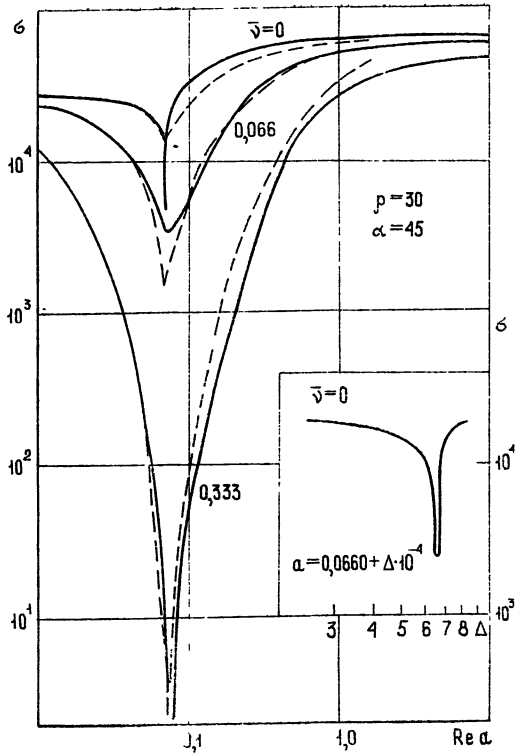


Рис. 3,

этом положение минимума (для монотонных профилей  $\varepsilon$ ) определяет в случае малых потерь критическое значение концентрации электронов на поверхности сферы. По ширине области минимума, исходя из строгого решения задачи для эталонных законов  $\varepsilon$ , можно оценить частоту соударений в плазме.

4. Аналогичные закономерности поведения СОР следует ожидать и для гладких тел несферической формы, при более общем виде неоднородности плазмы. Для количественного анализа в этих случаях может быть использован аналог метода физической оптики для неоднородных сред [4].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Н. П. Марьин, Радиотехника и электроника, 9, 235 (1968).
2. В. А. Пермьяков, Изв. высш. уч. зав. — Радиофизика, 11, № 4, 531 (1968).
3. В. А. Пермьяков, Изв. высш. уч. зав. — Радиофизика (в печати).
4. Ю. И. Орлов, Труды МЭИ, вып. 119, 82 (1972).

Московский энергетический институт

Поступила в редакцию  
17 сентября 1975 г.

УДК 538.59 : 519.25

### О СВЯЗИ ЛАГРАНЖЕВЫХ И ЭЙЛЕРОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ

А. Н. Малахов, А. И. Саичев

1. Во многих физических задачах представляет интерес исследование статистических свойств как эйлеровых, так и лагранжевых характеристик случайных полей, а также связи между ними. Некоторые из этих связей были рассмотрены в работах [1—3]. Данная статья посвящена установлению новых соотношений между лагранжевыми и эйлеровыми характеристиками случайных полей, дополняющих связи, найденные в [1—3].

2. Рассмотрим для определенности поле скоростей турбулентной жидкости  $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ . Введем связанное с ним поле концентрации пассивной примеси  $\rho(\mathbf{x}, t)$ , которое рассмотрим, пренебрегая молекулярной диффузией. Будем считать концентрацию примеси в начальный момент известной:  $\rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x})$ . Лагранжево распределение скорости, концентрации примеси и координат  $m$  фиксированных жидких частиц по определению равно:

$$f_m[\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \rho_1, \dots, \rho_m, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m; t_1, \dots, t_m | \mathbf{x}_{10}, \dots, \mathbf{x}_{m0}] \equiv \left\langle \prod_{i=1}^m \delta[\mathbf{v}_i - \mathbf{v}(\mathbf{x}_i, t_i)] \delta[\rho_i - \rho(\mathbf{x}_i, t_i)] \delta[\mathbf{x}_i - \mathbf{x}(t_i | \mathbf{x}_{i0})] \right\rangle. \quad (1)$$

Здесь  $\mathbf{x}_{10}, \dots, \mathbf{x}_{m0}$  — координаты рассматриваемых жидких частиц в начальный момент  $t_0$ ,  $\mathbf{x}(t_i | \mathbf{x}_{i0}), \dots, \mathbf{x}(t_m | \mathbf{x}_{m0})$  — их координаты в моменты  $t_1, \dots, t_m$ . Статистическое усреднение  $\langle \dots \rangle$  здесь идет по ансамблю случайных полей  $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ ,  $\rho(\mathbf{x}, t)$ ,  $\mathbf{x}(t | \mathbf{x}_0)$ .

Домножим (1) на  $\prod_{i=1}^m \rho_0(\mathbf{x}_{i0})$ , проинтегрируем по  $\mathbf{x}_{10}, \dots, \mathbf{x}_{m0}$  и учтем, что

$$\prod_{i=1}^m \int \int_{-\infty}^{\infty} \rho_0(\mathbf{x}_{i0}) \delta[\mathbf{x}_i - \mathbf{x}(t_i | \mathbf{x}_{i0})] d\mathbf{x}_{i0} = \prod_{i=1}^m \rho(\mathbf{x}_i, t_i). \quad (2)$$

В результате получим:

$$\int \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_m[\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \rho_1, \dots, \rho_m, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m; t_1, \dots, t_m | \mathbf{x}_{10}, \dots, \mathbf{x}_{m0}] \prod_{i=1}^m \rho_0(\mathbf{x}_{i0}) d\mathbf{x}_{i0} \equiv$$